



Projekt pt.: „Opracowanie metodyki badań i analiz struktury geometrycznej powierzchni technologicznie wytworzonych przedmiotów wykonanych z materiałów o różnej refleksyjności”, nr PM-II/SP/0046/2024/02 przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą Polska Metrologia II, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki.

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. - 31.01.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 999 530,40 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 999 530,40 zł

Data podpisania umowy: 14.02.2024 r.

Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między Politechniką Krakowską (Lider projektu), Politechniką Opolską oraz Politechniką Poznańską.

Zagadnienia objęte planem realizacji w ramach prezentowanego Projektu dotyczą obszaru metrologii warstwy wierzchniej ze szczególnym, uwzględnieniem struktury geometrycznej powierzchni w zakresie topografii powierzchni, jakości wytworzonych przedmiotów oraz sposobu weryfikacji jakości w drodze badań stanowiskowych z wykorzystaniem różnych metod i technik pomiarowych.

Projekt ma na celu opracowanie metodyki badań i analiz struktury geometrycznej powierzchni w zakresie topografii powierzchni wytworzonych technologicznie przedmiotów wykonanych z materiałów o różnej refleksyjności (różnym stopniu odbijania/pochłaniania światła), aby

możliwe było prowadzenie kompleksowej oceny jakości wyrobu przy wykorzystaniu bezstykowych systemów optycznych.

Projekt będzie realizowany w ramach agendy badawczej projektu „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej (RZAL)”, w zakresie badań struktury geometrycznej powierzchni. Należy podkreślić, że proponowane prace naukowo-badawcze są istotne z praktycznego punktu widzenia oraz komplementarne w odniesieniu do agendy badawczej projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” realizowanego przez Główny Urząd Miar.